# 乙炔流量對 Si-DLC 薄膜機械性質影響之研究

楊玉森<sup>1\*</sup> 羅安成<sup>1\*</sup> 鍾佳良<sup>1</sup> 1國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系

#### 摘要

本研究利用非平衡磁控濺鍍在 SKH51 高速鋼表面上濺鍍 Si-DLC 薄膜,主要是要探討乙 炔流量對 Si-DLC 薄膜機械性質之影響。實驗固定參數為中頻電源(矽及碳)靶電流 1.5 安培、 直流電源(碳)靶電源 3 安培、基材偏壓 60 伏特、基板治具轉速 9 rpm、基板偏壓頻率 100 仟 赫之、離子轟擊電壓-300 伏特。改變乙炔流量,從 0~10 sccm 為變數進行實驗。實驗結果由 Raman 分析得知,此薄膜中同時含有 SiC 與 Si-DLC 結構。在機械性質部分,當乙炔流量逐 漸上升時,磨耗率由原本的 1.43E-05 (mm<sup>3</sup> · N<sup>-1</sup> · m<sup>-1</sup>)降低為 1.30E-07 (mm<sup>3</sup> · N<sup>-1</sup> · m<sup>-1</sup>),其 耐磨耗性可提高 99 倍,而硬度從 Hv4037 降低為 Hv2905。

關鍵字:非平衡磁控濺鍍、Si-DLC 薄膜、乙炔流量

#### abstract

This study investigates the acetylene gas flow rate effect on mechanical properties of Si-DLC film, prepared by unbalanced magnetron sputtering process. The fixed process parameters are Si and C target current at 1.5 A by middle ratio frequency power generator, direct current on target at 3A, bias voltage of substrates at -60 V, rotation speed of substrate holder at 9 rpm, substrate pulse frequency at 100 kHz and ion beam voltage at -300 V in heating stage. The acetylene gas flow rate varied from 0 to 10 sccm. The experimental results of Raman specification analysis show that SiC and Si-DLC structures were both existence in silicon carbide films. Additionally, the results show that the wear rate of films decreases from 1.43E-5 to 1.30E-7 (mm<sup>3</sup>  $\cdot$  N<sup>-1</sup>  $\cdot$  m<sup>-1</sup>) with the increase of acetylene gas flow rate, i.e. 99 times than initial condition. Nevertheless, the hardness of films decreases from Hv<sub>10g</sub> 4037 to Hv<sub>10g</sub> 2905. It reveals that the films exhibit more wear resistance property.

Key word: unbalanced magnetron sputtering process . Si-DLC thin film . acetylene flow rate

## 一、前言

類鑚碳(Diamond-like Carbon, DLC)薄膜的特徵有:高硬度、優越的耐磨耗性、表面平 滑、摩擦係數小、耐腐蝕性優、近紅外光區的透光率佳以及絕緣性良好等,一般應用在刀具 鍍膜、切削工具及生醫工件上,其優越的特性可以提升工具的壽命,以降低生產的成本,但 DLC 最大的缺點在於,薄膜應力過大,因此附著力不好。近年來許多文獻將過渡金屬摻入 DLC 薄膜,例如:Ti、Zr、W等,形成含金屬之薄膜(Me-DLC)來降低薄膜內應力過高導致附 著力不好之問題,但 Me-DLC 薄膜因為金屬偏軟,因此當應力下降的同時,薄膜的硬度也會 隨之下降,無法兼顧有高硬度低磨耗之特性。

矽與碳同屬於元素週期表中的同族元素,且 SiC 有相當強得鍵結能力,因此將 Si 掺入 DLC 中,形成 Si-DLC 時,預期會因為其特性相近且 Si 原子半徑比 C 大,導致薄膜硬度不會因乙 炔通入應力釋放過大而導致硬度過低,並且保留有 DLC 的低磨耗特性。

本研究利用非平衡磁控濺鍍法於高速鋼(SKH51)上披覆 Si-DLC 薄膜,製程中添加反應性氣

體乙炔(C2H2),並改變乙炔流量,從0~10 sccm為變數,使實驗由一般濺鍍轉變為反應性濺鍍,對 Si-DLC 鍍膜之硬度與耐磨耗性進行探討。此研究由於機械及摩擦性質的提升,進而降低損耗成本。

# 二、實驗方法

### 2.1 實驗配置

本研究使用非平衡磁控濺鍍系統,靶源配置如 Fig.1 所示,共四組靶源,其中編號 1 為 矽靶,編號 2、3、4 為碳靶,本實驗使用直流電源(DC)及中頻電源(MF)兩種電源供應器,其 中中頻電源接在編號 1、3 靶,編號 2、4 靶接在直流電源,使矽及碳靶同時濺鍍,製程中添 加反應性氣體乙炔(C2H2)進行反應性濺鍍 Si-DLC 薄膜,並改變乙炔流量,從 0~10 sccm 中每 2 sccm 為變數,使實驗由一般濺鍍轉變為反應性濺鍍,並固定其他參數為 Si&C 靶電流 1.5A、 C 靶電源 3A、基材偏壓 60V、基板治具轉速 9 rpm、頻率 100 kHz、離子轟擊電壓-300V。 實驗參數如 Table.1 所示。實驗中控制濺鍍時間為 2 小時,以確保薄膜厚度約為 1.7~2 µ m。



DC power supply

Fig.1 • Experimental equipment (a)top view(b) Three-dimensional map Table1 • Experimental Parameters

實驗控制因子	最佳化參數	
A.乙炔流量	$0 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10$ sccm	
B.中頻電源(Si&C)靶電流	1.5 A	
C.直流電源(C)靶電源	3 A	
D.基板偏壓	60 V	
E.基板治具轉速	9 rpm	
F.頻率	100 kHz	
G.離子轟擊電壓	300 V	

註:工作距離(即基板到靶面的距離)9 cm、氫氣流量 35 sccm

利用FUTURE-TECH FM-700微硬度計進行鍍膜硬度量測,使用維克氏壓痕器為正四稜錐形的金剛石壓頭,其相對面夾角為136°,加壓荷重為10g,持壓時間為10秒,並利用 B. Jonsson 提出的薄膜真實硬度轉換公式[8]計算。

磨耗試驗係利用球對盤磨耗試驗機(Ball-on-disk wear tester),對磨球採用AISI 52100軸承 用鉻鋼球,試驗在室溫無添加任何潤滑劑下進行對磨,其磨耗條件為施加荷重5N、迴轉半徑 10 mm、滑移速度0.3 m/s、磨耗距離為1000 m,以量測薄膜與對磨材間的摩擦係數,並利用3D 輪郭儀量測斷面面積,掃描探針為尖端45°之鑽石探針,掃描速率為30 μ m/s,量測其磨耗軌跡 並計算磨耗體積及磨耗率,其中磨耗體積之算式如式1.1所示,磨耗率則為評量薄膜耐磨耗性 之重要參考依據,計算方式為單位磨耗長度及單位荷重下之磨耗體積[9]。

 $V = 2\pi RA$ 

$$=\pi \left[ r + \left(\bar{x} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{3y_{i+1} + |y_i - y_{i+1}|}{6y_{i+1} + 3|y_i - y_{i+1}|} \Delta x \right) \right] \cdot \sum_{i=1}^{n-1} (y_i + y_{i+1}) \Delta x$$
(1.1)

其中 V 為體積, R 為質心半徑, A 為不規則形狀面積。

利用機台型號 HITACHI TM-1000 的掃描式電子顯微鏡拍攝磨耗試驗所產生之磨耗軌跡, 電子光源為鎢陰極,成像訊號為背向散射電子(BSE),使用加速電壓為 15KV,表面放大倍 率為 60 倍。,並使用義守大學 Hitachi-4700 之 FE-SEM 量測薄膜厚度及成分分析。

利用 HORIBA JOBIN YVON (HR-800) Micro Raman/PL 微光致螢光拉曼光譜儀來 判斷薄膜中之 SP2 和 SP3 鍵結,本研究設定擷取拉曼散射的遷移波數 Range 為 700~1800 cm<sup>-1</sup>、 Confocal hole 為 200μm、objective 為 100X,時間為 10 sec、laser 強度 633。

# 三、結果與討論

#### 3.1 機械性質

Table.2 為薄膜機械性質表,當實驗中開始通入反應性氣體乙炔時,薄膜的硬度會下降, 根據圖 Fig.2 中可以看出硬度從 40GPa 下降到 28GPa,其原因為,當乙炔通入實驗中,乙炔 中的 H 原子會取代 SiC 中 sp<sup>3</sup>結構邊上的 C 原子及解離後的 C 原子因溫度而結合成 sp<sup>3</sup>結構 形成 DLC 薄膜,而造成薄膜的應力釋放,因此硬度下降, 根據 Fig.3 中可以看出,當乙炔流 量逐漸上升時,薄膜硬度會漸漸下降而磨耗率也漸漸的變好,為了進一步確認乙炔中矽含量 造成的影響,因此透過 EDS 進行檢測,由 Fig.4 可以發現當沒有通乙炔時,Si 含量達 43.04%, 而當乙炔流量為 10 sccm 時,Si 含量僅剩下 21.8%,其原因為當乙炔流量越高時,Si 靶表面 反應越緻密,因此透過 Ar+撞擊出的 SiC 就會越少,而轉換為 Si-DLC 的部分就會變多,當乙 炔流量達飽和點(8 sccm)後,Si 靶呈現靶中毒現象,因為 Si 含量下降趨勢漸緩,接近一個平 衡的狀態,從實驗數據中可以發現,當乙炔流量達飽和點時,磨耗率最低可以降到 1.30E-07 (mm<sup>3</sup>·N<sup>-1</sup>·m<sup>-1</sup>),且硬度然保有約 Hv3000 左右,Fig.5 為乙炔流量逐一因子之磨耗軌跡圖,根 據圖中可以發現,當乙炔流量逐漸增加時,磨耗軌跡明顯的越來越窄,且刮損越少,當乙炔 流量達 10 sccm 時,表面經過磨耗後,由於磨損不明顯,並無法從 SEM 正確判斷其磨耗的軌 跡,跟原始參數做比較磨耗率由原本的 1.43E-05 (mm<sup>3</sup> · N<sup>-1</sup> · m<sup>-1</sup>)降低為 1.30E-07 (mm<sup>3</sup> · N<sup>-1</sup> · m<sup>-1</sup>),其耐磨耗性提高約 99 倍,而硬度從 Hv4037 降低為 Hv2905,判定此薄膜參 數即:乙炔流量 8 sccm、中頻電流 1.5A、C 靶電源 3A、基材偏壓 60V、基板治具轉速 9 rpm、 頻率 100 kHz、離子轟擊電壓-300V,為 Si-DLC 薄膜中具有高硬度低磨耗率特性之薄膜。

組別	硬度	磨耗率	沉積速率
	(Hv)	$(\mathrm{mm}^3 \cdot \mathrm{N}^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-1})$	( µ m/hr)
1	4037±277	1.43E-05	0.85
2	3499±253	8.04E-07	0.99
3	3818±207	1.01E-06	0.94
4	3153±86	2.79E-07	0.98
5	2905±230	1.30E-07	1.21
6	2894±197	1.71E-07	1.03

Table.2 乙炔流量逐一因子實驗薄膜性質表



Fig.2 乙炔流量逐一因子硬度分布圖





Fig.5 乙炔流量逐一因子磨耗軌跡圖; (a) 0 sccm,(b) 2 sccm,(c) 4 sccm, (d) 6 sccm.(e) 8 sccm,(f) 10 sccm

## 3.2 鍵結性質分析

Fig.6 為拉曼分析圖,經由文獻中了解,DLC 薄膜是經由 C 原子以 sp<sup>2</sup>及 sp<sup>3</sup>鍵結混合而成,而 sp<sup>3</sup>鍵結在拉曼分析中對應之波長為 1350cm<sup>-1</sup>(D band), sp<sup>2</sup>鍵結對應之波長為 1580cm<sup>-1</sup> (G band),當乙炔流量為 0 sccm 及 2 sccm 時,薄膜呈現的是 sp<sup>3</sup>的 C 鍵結,而 4 sccm 到 10 sccm 的薄膜就很明顯的都有出現 sp<sup>2</sup>及 sp<sup>3</sup>的波長,所以薄膜結構為 DLC 結構,並且於波長 1180 cm<sup>-1</sup>及 1500cm<sup>-1</sup>處,也發現有 C 原子的其他鍵結,根據[8]中說到 SiC 鍵結中 1s 及 2p 分別會出現在 766cm<sup>-1</sup>及 965cm<sup>-1</sup>本實驗之薄膜中也含有 SiC 的鍵結

Fig.7 為拉曼圖經由高斯分解後,其中可發現,當乙炔含量低時(0~2 sccm),拉曼圖中並 沒有出現 G band,僅有出現 D band,而當乙炔流量高於 4 sccm 時,均有出現代表 DLC 薄膜 的 D band 跟 G band,並且根據拉曼分解圖中可發現本實驗之薄膜均含有波長 1180 cm<sup>-1</sup> 及 1500cm<sup>-1</sup> 的 C 雙鍵鍵結,因此根據此薄膜均含有此 4 種 C 鍵結,判定此薄膜為 DLC 薄膜, 根據[7]中說到,拉曼分析圖中波長 1180 cm<sup>-1</sup> 及 1500cm<sup>-1</sup>處所形成的 C 鍵結為 C=C 雙鍵的線 性鍵結。



# 四、結論

本研究利用非平衡磁控濺鍍於 SKH51 高速鋼表面上濺鍍 Si-DLC 薄膜,主要是要探討乙 炔流量對 Si-DLC 薄膜機械性質之影響。所得結論如下:單一改變乙炔流量,從 0~10 sccm 為 變數,當乙炔流量逐漸上升時,磨耗率由原本的 1.43E-05 ( $mm^3 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1}$ )降低為 1.30E-07 ( $mm^3 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1}$ ),其耐磨耗性提高約 99 倍,而硬度從 Hv4037 降低為 Hv2905,因此判定此 薄膜參數即:乙炔流量 8 sccm、中頻電流 1.5A、C 靶電源 3A、基材偏壓 60V、基板治具轉 速 9 rpm、頻率 100 kHz、離子轟擊電壓-300V,為 Si-DLC 薄膜中具有高硬度低磨耗率特性 之薄膜。

# 五、參考文獻

- [1] Donald M. Mattox, 1998, <u>HANDBOOK OF PHYSICAL VAPOR DEPOSITIO (PVD)</u> <u>PROCESSING</u>, Westwood, N.J. : Noyes Publication.
- [2] M.Van Stappen., 1995, <u>State of the art fro the industrial use of ceramic PVD Coatings</u>, Surface and Coating Technology, vol74-75, p.629~633.
- [3] Yucong Wang, 1997, <u>A Study of PVD coatings and die materials for extended die-casting die life</u>, Surface and Coating Technology, vol.94-95, p.60~63.
- [4] J.A.Thornon,1974,<u>Influence of apparatus geometry and deposition conditions on the structure</u> and topography of thick szputtered coatings.Journal of Vacuum Science <u>Technology</u>.Vol.11,p.666-670.
- [5] R.D. Bland, G.J. Kominiak, D.M. Mattax, 1984, Journal of Vacuum Science Technology, A2(4), p.671.
- [6] R.Messier, A.P. Giri, R.A. Roy, 1984, <u>Revised Structure Zone Model for Thin Films Physical</u> <u>Structure.Journal of Vacuum Science Technology</u>, A2(2), p.671.
- [7] C. Srisang, P. Asanithi K. Siangchaew A. Pokaipisit P. Limsuwan, <u>Characterization of SiC in DLC/a-Si films prepared by pulsed filtered cathodic arc using Raman spectroscopy and XPS</u>, Applied Surface Science 258 (2012) p.5605 – p.5609.
- [8] K. Awazua,c,U, N. Sakudob, H. Yasuic, E. Sajid, K. Okazakie, Y. Hasegawaf,N. Ikenagag, K. Kandah, Y. Namboi, K. Saitohk, <u>DLC films formed by hybrid pulse plasma coating (HPPC)</u> <u>System</u>, Surface and Coatings Technology 136 (2001). p.172-p.175.
- [9] C. Jaoul O. Jarry P. Tristant T. Merle-Méjean, M. Colas, C. Dublanche-Tixier, J.-M. Jacquet, <u>Raman analysis of DLC coated engine components with complex shape:Understanding wear</u> <u>mechanisms</u>, Thin Solid Films 518 (2009)p. 1475 – p.1479.
- [10] Y.N. Koka,T, P.Eh. Hovsepiana, R. Haaschb, I. Petrovb, <u>Raman spectroscopy study of C/Cr</u> <u>coatings deposited by the combined steered cathodic ARC/unbalanced magnetron sputtering</u> <u>technique</u>, Surface & Coatings Technology 200 (2005) p.1117–p. 1122.
- [11] Kang-San Kim, Ki-Bong Han, Gwiy-Sang Chung, <u>Analysis of mechanical properties of N2 in situ doped polycrystalline 3C-SiC thin films by chemical vapor deposition using single-precurs or hexamethyildisilane</u>, Physica B 405 (2010) p.513–p.516.